

Научная программа стендовых докладов
XXVII-ой Российской конференции по электронной микроскопии

Название секции. I. Новые методы просвечивающей/растровой электронной микроскопии, электронной дифракции и микроанализа. Новые приборы, элементы электронной оптики, детекторы и обработка изображений.

ФИО докладчика	Название доклада
<u>Алексеева Е.В.</u> , Кулешова Е.А., Фролов А.С., Сафонов Д.В.	<i>Разработка и применение программного модуля для определения ориентации кристаллитов в ГПУ-материалах</i>
Амрастанов А.Н., Серегина Е.В., <u>Степович М.А.</u>	<i>Оценка нагрева поверхности однородной металлической мишени электронным зондом</i>
<u>Васильева А.В.</u> , Дарзбек С.А., Желкобаев Ж.Е., Фурдилова М.А., Царбаев Р.Х.	<i>Использование методов и средств лазерной нанометрии в прикладных технологиях: неразрушающий контроль и техническая диагностика (НКТД)</i>
Васин О.И., Правдюк В.П., Кулаков А.А.	<i>Новый подход к вопросу о нормировке интенсивности рассеяния электронов на аморфных образцах</i>
Гелевер В.Д.	<i>Возможности режима прошедшего рентгена в РЭМ для исследования тонких объектов</i>
Глухов В.С.	<i>Использование преобразования Фурье при анализе изображений доменной структуры кристаллов семейства триглицинсульфата</i>
Горбачев И.А., Смирнов А.В., Аткин В.С., Глуховской Е.Г., Вениг С.Б.	<i>Применение просвечивающей электронной микроскопии для оценки типа и качества упаковки квантовых точек в Ленгмюровских монослоях на твердых подложках</i>
Заводов А.В., <u>Зайцев Д.В.</u> , Светлов И.Л., Кузьмина Н.А.	<i>Определение ОС и плоскостей сопряжения γ-силицидов с матрицей на основе твердого раствора Nb методами просвечивающей электронной микроскопии</i>
Зарубин А.Н., Колесникова И.И., Лозинская А.Д., Михайлов Т.А., Новиков В.А., Толбанов О.П., Тяжев А.В., Шемерянкина А.В., Щербаков И.Д., Щербаков П.С.	<i>Арсенид галлиевые матричные сенсоры для электронной микроскопии</i>
Казьмирук В.В., Курганов И.Г., Подкопаев А.А., Савицкая Т.Н.	<i>Анализ характеристик тракта регистрации сигналов РЭМ по видеоизображениям</i>
Казьмирук В.В., Курганов И.Г., Подкопаев А.А., Савицкая Т.Н.	<i>Расчет электронно-оптической системы РЭМ с LaB₆ катодом</i>
<u>Крисько О.В.</u> , Скоробогатова Т.В.	<i>Температурная зависимость теплового структурного фактора металлов в модели гладкого нелокального модельного потенциала</i>
<u>Кулыгин А.К.</u> , Авилов А.С., Новикова В., Кулыгин К.В., Лепешов Г.Г.	<i>Новые подходы к прецизионным измерениям электронограмм</i>
Курганов И.Г.	<i>Моделирование электростатической объективной линзы растрового электронного микроскопа</i>

Кязумов М.Г., Рустамова Л.В.	<i>Дифракция электронов от нанопленок, искривленных вокруг случайных осей</i>
Ларионов Ю.В.	<i>Влияние контаминации на параметры выступа в высоковольтном РЭМ</i>
Ларионов Ю.В., Озерин Ю.В.	<i>Осаждение контаминационной пленки на выступ в низковольтном РЭМ</i>
Сокура Л.А., Неведомский В.Н., Берг Н.А.	<i>Особенности формирования муара на электронно-микроскопических изображениях квантовых точек, содержащих дислокации</i>
Суродин С.И., Шоболов Е.Л., Николичев Д.Е.	<i>Подготовка поперечных сколов для РЭМ методом трехлучевой ионной резки</i>
Шкорняков С.М.	<i>Аналитическое выражение для описания осцилляций интенсивности зеркального рефлекса от поверхности растущей гетероэпитаксиальной пленки</i>

Название секции. 2. Крио-ЭМ и применение электронной, конфокальной сканирующей микроскопии в биологии и медицине.

ФИО докладчика	Название доклада
Daminova A.G., Gorshkov V.Y., Ageeva M.V., Petrova O.E., Mikshina P.V., Gogolev Y.V.	<i>Colonization strategy of Solanaceae plants by the phytopathogen Pectobacterium atrosepticum SCRI1043</i>
Hovnanyan K., Navasardyan L., Marutyuan S., Hovnanyan M., Gasparyan H., Trchounian A.	<i>Ultrastructural analysis of yeast Candida guilliermondii VP-4 during cultivation at nitrogen deficiency</i>
Marin E., Luginina A., Gusach A., Mishin A., Kovalev K., Borshchevskiy V., Cherezov V.	<i>MEMBRANE PROTEIN STRUCTURE DETERMINATION from twinned data USING X-RAY FREE ELECTRON LASER</i>
Алехова Т.А., Васильев А.Л., Загустина Н.А., Новожилова Т.Ю., Чвалун Н.С.	<i>Биокоррозионные повреждения конструкционных алюминий-магниевого сплава, исследования методами РЭМ с помощью ППК</i>
Андреевская С.Г., Шевлягина Н.В., Псеунова Д.Р.	<i>Сканирующая электронная микроскопия клинических изолятов Staphylococcus aureus после воздействия антибактериальных препаратов разных групп</i>
Ахатов Е.А., Манькин А.А.	<i>Электронная микроскопия как инструмент экспресс диагностики вирусных заболеваний сельскохозяйственных растений</i>
Бабоша А.В., Лошакова П.О., Упельник В.П.	<i>Микроморфологические особенности поверхности листьев некоторых видов рода Elitrigia (Poaceae)</i>
Байбеков И.М., Бутаев А.Х.	<i>Низкоинтенсивное лазерное излучение не индуцирует опухолевый рост (Электронномикроскопические исследования)</i>
Байбеков И.М., Ирханов М.М., Аббасова М.Г.	<i>Ультраструктура слизистой оболочки полости рта при протезных стоматитах и лазерных воздействиях</i>
Баймухаметов Т.Н., Чесноков Ю.М., Афонина Ж.А., Мясников А.Г., Васильев А.Л.	<i>Исследование пространственной организации макромолекулярных комплексов методами крио-электронной томографии</i>
Боков А.В., Лямкин П.В.,	<i>Исследование цианобактерии Arthrospira platensis</i>

Коннычев М.А., Рогожкин С.В., Степанов С.В., Столбунов В.С.	<i>методом атомно-силовой микроскопии</i>
Бугрова М.Л., Галкина М.В., Яковлева Е.И.	<i>Применение иммуноцитохимии «post-embedding» в исследовании натрийуретических пептидов</i>
Бутаев А.Х., Мардонов Д.Н.	<i>Электронная микроскопия взаимодействия шовного материала с тканями кожных ран под влиянием лазерного и светодиодного излучения</i>
Геворкян М.М., Бабоша А.В., Лошакова П.О., Упелниек В.П.	<i>Особенности анатомической структуры листовых пластинок пшеницы, полученных в результате межвидовых скрещиваний</i>
Грефнер Н.М., Громова Л.В., Комиссарчик Я.Ю.	<i>Иммуноцитохимическое исследование распределения транспортеров глюкозы SGLT1 и GLUT2 в энтероцитах с применением электронной и конфокальной микроскопии</i>
Гущина Е.А., Лисицын Ф.В., Лопатина О.А., Суэтина И.А., Исаева Е.И., Ковалевский Ц.А., Буданов Б.А., Даличик Ф.А., Мезенцева М.А.	<i>Электронная микроскопия суспензии вируса гриппа A/Aichi/(H₃N₂) обработанных полиоксометаллатами различного состава (ПОМ)</i>
Дробышева И.М.	<i>Умножение центриолей в клетках мерцательного эпителия у археофорных и неоофорных турбеллярий</i>
Евтюгин В.Г., Рогов А.М., Валеева Л.Р., Сальников В.В., Осин Ю.Н., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Степанов А.Л.	<i>Наноструктурированные подложки для подсчета бактерий, полученные методом ионной имплантации</i>
Жуйкова Ю.В., <u>Зубарева А.А.</u> , Варламов В.П.	<i>Создание тонких плёнок на основе хитозана для биомедицинского применения</i>
<u>Жуховицкий В.Г.</u> , Андреевская С.Г., Мругова Т.М., Качалова И.В.	<i>Применение сканирующей электронной микроскопии при микробиологической диагностике бактериемии</i>
<u>Зиновьев С.В.</u> , Плехова Н.Г., Радьков И.В.	<i>Электронно-микроскопическая характеристика диагностического значения флеботомии левой каудальной легочной вены белых крыс</i>
Зубашева М.В., Смирнова Т.А., Шевлягина Н.В., Жуховицкий В.Г.	<i>Изучение морфологии спор <i>Brevibacillus laterosporus</i> с помощью электронной микроскопии</i>
Иванова А.И., Курбатова Л.А.	<i>Электронно-микроскопический анализ кристалломорфологических картин в биологических жидкостях</i>
Казанцев А.В., Ерохин П.С., Уткин Д.В., Осина Н.А., Абдрашитова А.С.	<i>Оценка морфофункциональных свойств уропатогенных штаммов <i>Escherichia coli</i> методом атомно-силовой микроскопии</i>
Королев Ю.Н., Гениатулина М.С., Никулина Л.А.	<i>Ультраструктура адренкортикоцитов при профилактическом применении низкоинтенсивного электромагнитного излучения в условиях радиации</i>
Королев Ю.Н., Гениатулина М.С., Никулина Л.А.	<i>Ультраструктурные изменения в клетках Сертоли и сперматогониях при действии низкоинтенсивного электромагнитного излучения в условиях радиации</i>
Кузьмина Н.В.	<i>Амилоидные нанофибриллы</i>
Кумахова Т.Х.	<i>Особенности ультраструктуры хлоропластов в клетках перикарпия <i>Malus Mill.</i> (Rosaceae), произрастающих в горах</i>

Сульдина Л.А., Кизилова Е.А., Морозова К.Н., Киселева Е.В..	<i>Различие морфометрических параметров и ультраструктурной организации клеток химерных бластоцист, полученных методами инъекции или агрегации с эмбриональными стволовыми клетками</i>
Леонова О.Г., Караджян Б.П., Скарлато С.О., Попенко В.И.	<i>Трёхмерная организация ядрышкового домена в пространстве соматического ядра инфузории <i>Didinium nasutum</i> и локализация ключевых ядрышковых белков в нём</i>
Мазина С.Е., Шушпанова Д.В., Козлова Е.В., Боков А.В.	<i>Применение криофиксации для подготовки водорослей к исследованию методом сканирующей электронной микроскопии</i>
Манькин А.А., Лисицын Ф.В.	<i>Эжекция фаговой ДНК через отросток под действием формамида</i>
Мотылева С.М.	<i>Применение аналитического РЭМ для выявления кристаллоносных клеток в тканях растений и определения их элементного состава</i>
Неретина А.Н.	<i>Перспективы использования растровой электронной микроскопии в систематике тропических ветвистоусых ракообразных (Crustacea: Cladocera)</i>
Пичугова С.В., Тулакина Л.Г., Савинова Т.Л., Лебедева Л.М., Бейкин Я.Б.	<i>Ультраструктурные изменения плаценты при антенатальной гибели плода</i>
Плиева З.С., Смирнова Т.А., Андреевская С.Г., Жуховицкий В.Г.	<i>Электронно-микроскопическое изучение биоплёнок, образуемых <i>Vacillus cereus</i></i>
Плиева З.С., Смирнова Т.А., Андреевская С.Г., Шевлягина Н.В., Богданов И.А., Жуховицкий В.Г.	<i>Электронномикроскопическое изучение штаммов <i>Vacillus cereus</i> различного происхождения</i>
Плотников А.Д., Алехова Т.А., Корнеева Е.Ю., Новожилова Т.Ю., Загустина Н.А.	<i>Исследование биокоррозии образцов алюминий-магниевых методами сканирующей лазерной микроскопии и рентгеновской томографии, влияние коррозии на прочностные характеристики сплавов АМг6 и 1570</i>
Рашковский А.Ю., Рыжов А.П., Дмитриева Т.Г.	<i>Исследование полимерных покрытий биodeградируемых стентов</i>
Семенова С.Б., Кевер Л.В., Комиссарчик Я.Ю.	<i>Ассоциация каналов TRPV6 с липидными рафтами в клетках <i>Jurkat</i></i>
Смирнова Е.А., Букаева И.А., Бежанова С.Д., Иванова Т.А.	<i>Ультраструктурная гетерогенность онкоцитом почек человека</i>
Солдатенко Е.В., Петров А.А.	<i>РЭМ и конфокальные исследования дистальных отделов половой системы пресноводных моллюсков</i>
Уткин Д.В., Булгакова Е.Г., Ерохин П.С., Кузнецов О.С., Куклев В.Е., Осина Н.А.	<i>Оценка влияния температуры на морфологию клеток бактерий <i>Yersinia pestis</i> методом атомно-силовой микроскопии</i>
Хацаева Р.М.	<i>Компенсаторные механизмы в слизистой оболочке полости рта у жвачных животных</i>
Хуторская И.А., Балашов В.П., Евтюгин В.Г., Шаймарданова Г.Ф., Абрамов В.Н., Герасимова Н.Г.	<i>Морфология скелетных мышц крыс при моделировании динамической физической нагрузки и действия L-карнитина</i>

Чабан Е.М., Солдатенко Е.В.	<i>РЭМ-морфология пениальной папиллы как важный диагностический признак в систематике заднежаберных моллюсков</i>
Чуфаров А.Ю., Григоров И.Г.	<i>Фрактальный анализ биокомпозита на основе высокопористого ячеистого материала</i>
Шаймарданова Г.Ф., Тяпкина О.В., Резвяков П.Н., Исламов Р.Р., Никольский Е.Е.	<i>Влияние длительного космического полета на состояние спинного мозга и седалищного нерва мышцы</i>
Шатров А.Б.	<i>Ультраструктура дермальных желез водяного клеща <i>Limnochares aquatica</i> (L., 1758) (Acariformes, Limnocharidae) и их функциональное значение</i>
Эльдаров Ч.М.	<i>Особенности структурной организации мышечных клеток червей-волосатиков <i>Gordionus alpestris</i></i>
Яценко А.А., Целуйко С.С., Устинов Е.М., Леонов Д.В., Кушнарев В.А.	<i>Растровая микроскопия децеллюризованного лёгкого крысы для использования в тканевой инженерии и культивировании клеток</i>

Название секции. 3. Электронная микроскопия, электронная дифракция и микроанализ в исследовании новых материалов.

ФИО докладчика	Название доклада
Rashkovets M.V., Nikulina A.A.	<i>Phase composition of heat-resistant nickel-base alloy in additive manufacturing</i>
Абрамова Е.Н., Артемов В.В., Хорт А.М., Яковенко А.Г., Слипченко Е.А.	<i>Исследования слоёв и наночастиц пористого кремния (por-Si) методом электронной микроскопии</i>
Абросимова Г.Е., Волков Н.А., Аронин А.С., Орлова Н.Н.	<i>Влияние Nb на кристаллизацию аморфного сплава системы Co-Fe-Si-B-Nb.</i>
Агарков Д.А., Борик М.А., Бублик В.Т., Бредихин С.И., Кулебякин А.В., Курицина И.Е., Ломонова Е.Е., Милович Ф.О., Мызина В.А., Осико В.В., Табачкова Н.Ю.	<i>Структура и транспортные свойства твердых растворов ZrO₂ легированных Sc₂O₃ и CeO₂</i>
Алекперов Э.Ш., Назаров А.М., Фарзалиев С.С.	<i>Кинетика кристаллизации получаемых в электрическом поле аморфных плёнок TIn_{1-x}Sn_xS₂</i>
Аронин А.С., Аристова И.М., Васнев В.В., Мироненко В.Н.	<i>Нанопорошок в структуре алюмоматричного порошкового композита</i>
Афанасенкова Е.С., Жигач А.Н., Кусков М.Л., Лейпунский И.О., Березкина Н.Г., Сафронова О.А., Дудин А.А.	<i>Получение левитационно-струйным методом и исследование структуры нанопорошков карбида титана</i>
Афанасенкова Е.С., Жигач А.Н., Кусков М.Л., Лейпунский И.О., Березкина Н.Г., Сафронова О.А., Сиротина А.П., Белов В.С.	<i>Получение левитационно-струйным методом и исследование структуры нанопорошков "сплава" железо-медь</i>
Афанасенкова Е.С., Жигач А.Н., Кусков М.Л., Лейпунский И.О., Березкина Н.Г., Сафронова О.А.	<i>Исследование структуры нанопорошков системы Fe-C, получаемых левитационно-струйным методом</i>
Баран Л.В.	<i>Растровая электронная микроскопия композитных плёнок системы фуллерит-алюминий-олово</i>

<u>Баскаков Е.Б.</u> , Стрелов В.И., Михеев Н.Н., Волчков И.С.	<i>Исследование состава пленок SmS, полученных магнетронным распылением</i>
Берт Н.А., Неведомский В.Н., Чалдышев В.В., Cherkashin N.A., Преображенский В.В., Путято М.А., Семягин Б.Р.	<i>Состав и микроструктура металлических нановключений AsSb в LTG-AlGaAsSb</i>
Бойцова О.В., Леонтьев А.П., Игонина Е.Д., Елисеев А.А.	<i>Электронная микроскопия и электронная дифракция в изучении метастабильных состояний на примере органо-неорганических мезокристаллов</i>
Болотов В.В., Ивлев К.Е., Кан В.Е., <u>Князев Е.В.</u> , Поворознюк С.Н., Соколов Д.В.	<i>Модификация электрофизических свойств индивидуальных многостенных углеродных нанотрубок под воздействием ионного облучения и отжига в инертной среде</i>
Вирюс А.А., Коровушкин В.В., Шипко М.Н., Труханов А.В., <u>Степович М.А.</u> , Костишин В.Г., Миронович А.Ю.	<i>Особенности магнитной и кристаллической структуры гексагонального феррита $BaFe_{12-x}In_xO_{19}$</i>
<u>Волков Р.Л.</u> , Савчук Т.П., Гаврилин И.М., Дронов А.А., Боргардт Н.И., Гаврилов С.А.	<i>Исследование влияния условий термообработки на состав и структуру пористого анодного оксида титана методом просвечивающей электронной микроскопии</i>
<u>Герасимов Е.Ю.</u> , Исупова Л.А., Цыбуля С.В.	<i>Формирование микроструктурных особенностей перовскитоподобных оксидов в средах с низким парциальным давлением кислорода</i>
<u>Гнесин И.Б.</u> , Гнесин Б.А., Некрасов А.Н.	<i>Изучение удельной поверхности трещин в покрытиях на углерод-углеродных композитах</i>
Горбачев И.А., Смирнов А.В., Аткин В.С., Глуховской Е.Г., Вениг С.Б.	<i>Применение просвечивающей электронной микроскопии для оценки типа и качества упаковки квантовых точек в Ленгмюровских монослоях на твердых подложках</i>
Григорьев Ю.В., <u>Каримов Д.Н.</u> , Ивановская Н.А.	<i>Изучение нанокристаллов флюоритовой фазы SrF_{2+x} полученных методом механохимического синтеза</i>
<u>Григорьев Ю.В.</u> , Сульянов С.Н., Синайский М.А., Пахило-Дарьял И.О., Литвинова И.С.	<i>Исследование частиц типа ядро-оболочка на основе оксидов Hf-Y-Al полученных плазмохимическим синтезом</i>
Донцов А.И., <u>Синецкая Д.А.</u> , Горбунов С.В.	<i>Электронно-микроскопическое исследование композитной мембраны с тонким селективным слоем основе твердых растворов Pd-Cu и Pd-Pb на поверхности двухслойной гетероструктуры с двухуровневой пористостью</i>
Елисеев А.А., Вербицкий Н.И., Вольхов А.А., Кумсков А.С., Басу В.Г., Васильев А.Л., Киселев Н.А.	<i>Кристаллография и электронное строение одномерных нанокристаллов в условиях пространственного ограничения</i>
<u>Жарков С.М.</u> , Алтунин Р.Р., Моисеенко Е.Т.	<i>Электроннографические in situ исследования структурных фазовых превращений при твердофазной реакции в двухслойной тонкопленочной наносистеме Al/Pt</i>

Жигалина О.М., Дегтярева А.Г., Хмеленин Д.Н., Симонов В.Н.	<i>Структура стали после обработки деформирующим резанием</i>
Жигалина О.М., Хмеленин Д.Н., Иванов И.М., Загорский Д.Л., Бедин С.А., Долуденко И.М.	<i>Электронная микроскопия нанопроволок Cu/Ni</i>
Зеер Г.М., Зеленкова Е.Г., Ледяева О.Н.	<i>Электроконтактный материал на основе Ag, дисперсно-упрочненный нанопорошками оксидов Zn, Sn и Ti</i>
Золоторевский Н.Ю., <u>Ушанова Э.А.</u> , Рыбин В.В.	<i>Исследование эволюции разориентировок границ деформационного происхождения методом EBSD-анализа</i>
<u>Зыбина Ю.С.</u> , Приходько А.С., Боргардт Н.И., Zallo E., Calarco R.	<i>Исследование атомарного строения эпитаксиального слоя $Ge_3Sb_2Te_6$ методом высокоразрешающей электронной микроскопии</i>
<u>Ищенко А.В.</u> , Мосеенков С.И., Казакова М.А., Кузнецов В.Л.	<i>Исследование композитных материалов Fe,Co@УНТ методами ПЭМВР</i>
<u>Калита В.И.</u> , Чернов М.С., Соколов В.Н.	<i>Микроструктурные исследования плазменных покрытий гидроксиапатита на титановых подложках</i>
<u>Каратеев И.А.</u> , Овешников Л.Н., Селиванов Ю.Г., Чижевский Е.Г., Аронзон Б.А., Васильев А.Л.	<i>Характеризация Eu содержащих дефектов в матрице Bi_2Se_3</i>
<u>Касумов Ю.А.</u> , Волков В.Т., Касумов А.Ю., Ходос И.И.	<i>Структура нанопроволок Bi, полученных методом ВЧ-диодного распыления на различных подложках</i>
Кийко В.М., Колчин А.А., Милейко С.Т., Новохатская Н.И.	<i>Структура композитных волокон и пластин, полученных из оксидов алюминия и кальция</i>
Кийко В.М., Коржов В.П.	<i>Структура и разрушение слоистого Mo-Si-B композита</i>
Кириленко Д.А.	<i>Измерение спектра изгибных фононов свободного графена в области малых волновых векторов</i>
Колосов В.Ю., Веретенников Л.М., <u>Юшков А.А.</u> , Бокуняева А.О.	<i>Электронная микроскопия тонких плёнок висмута, полученных вакуумным напылением</i>
Колосов В.Ю., <u>Юшков А.А.</u> , Андреев С.В., Кудреватых Н.В.	<i>Электронная микроскопия структур, формируемых в быстрозакаленных магнитных сплавах состава SmZrFeTi</i>
Коржов В.П., Кийко В.М.	<i>Особенности структуры слоистого композита на основе ниобия</i>
<u>Коржов В.П.</u> , Кийко В.М., Желтякова И.С.	<i>Характеристики и особенности слоистой структуры жаропрочного композита на основе (Nb-Ti)-сплава</i>
Кравец В.А., Иванова Е.В., Яговкина М.А., Ситникова А.А., Седова И.В., Заморянская М.В.	<i>Деградация гетероструктур на основе соединений A_2B_6 при облучении электронным пучком средних энергий</i>

Николичев Д.Е., Крюков Р.Н., Усов Ю.В., Павлов Д.А., Дорохин М.В., Звонков Б.Н., Зубков С.Ю.	<i>Состав и структура слоев GaMnAs, выращенных методом импульсного лазерного осаждения</i>
Кузнецова Д.Е., Досовицкий Г.А., Волков П.А., Коржик М.В., Досовицкий А.Е., Бобкова Т.И., Михайлов М.С.	<i>Применение методов электронной микроскопии для решения технологических задач при получении порошков сложных оксидов со структурой граната</i>
Кузьмин А.В., Рашковский А.Ю., Каменев А.А.	<i>Анализ структуры дефектов слоев высокотемпературных сверхпроводящих лент 2-го поколения</i>
Кулешова Е.А., Фролов А.С., Мальцев Д.А., Кутузов Л.В., Алексеева Е.В., Сафонов Д.В., Козлов И.В., Степанов Н.В.	<i>Исследование ориентации зерен в сплаве циркония Э110 в условиях облучения и испытаний на ползучесть</i>
Кулинич В.И., Бубликов Е.И., Коломиец В.В., Лялько Е.С., Чертова И.А.	<i>Применение методов ПЭМ при формировании сегментированных магнитных наноструктур</i>
Кумсков А.С., Закалюкин Р.М., Левкевич Е.А., Орехов А.С.	<i>Нанокопозиты внедрения в ОСУНТ на основе ионных проводников</i>
Кущев С.Б., Рябцев С.В., Солдатенко С.А., Синельников А.А.	<i>Электронно-микроскопическое исследование структуры и субструктуры оксидированных пленок Pd-Ru</i>
Макарова И.П., Селезнева Е.В., Коморников В.А., Васильев А.Л.	<i>Структурные особенности кристаллов гидросульфат-фосфатов цезия и их влияние на физические свойства</i>
Маньшина А.А., Поволоцкая А.В., Петров Ю.В., Данилов Д.В.	<i>Гибридные Au-Ag/C наноструктуры с управляемой морфологией, полученные в результате лазерно-индуцированного осаждения</i>
Милейко С.Т., Кийко В.М.	<i>Характеристики разрушения композита с хрупкой молибденовой матрицей и волокнами на основе сапфира и гексаалюмината кальция</i>
Михайловский В.Ю., Данилов Д.В., Болтынюк Е.В., Убийвовк Е.В.	<i>Приготовление ламелей из металлических стекол методов сфокусированного ионного пучка</i>
Муравьева Т.И., Щербакова О.О., Загорский Д.Л.	<i>Исследование протекторных резин методом электронной микроскопии</i>
Муслимов А.Э., Буташин А.В., Кольмагин А.Б., Каневский В.М.	<i>Комплексная микроскопия пленок AlN, полученных твердофазной эпитаксией на поверхности сапфира</i>
Николайчик В.И., Рощупкин Д.В., Ковальчук М.Н.	<i>Электронно-микроскопическое исследование кристаллов семейства лантан-галлиевого силиката $La_3Ga_5SiO_{14}$ и $Ca_3TaGa_3Si_2O_{14}$</i>
Новикова В.В.	<i>Об особенностях электронного строения фторидов некоторых щелочноземельных и редкоземельных элементов</i>
Ноженков М.В., Авилов А.С., Лобанова Е.С.	<i>Сверхнизкое трение легированных композиционных покрытий</i>

<u>Нуриев И.Р.</u> , Назаров А.М., Мехрабова М.А., Садыгов Р.М., Абдуллаева А.А., Мирзоев Э.И.	<i>Особенности роста и морфология поверхности эпитаксиальных пленок $Cd_{1-x}Fe_xTe$</i>
Парфёнов Н.М., <u>Годовицын И.В.</u>	<i>Исследование морфологии поверхности мембраны высокотемпературного преобразователя давления</i>
<u>Попов В.А.</u> , Вершинина Е.В., Ковальчук М.Н.	<i>Применение просвечивающей электронной микроскопии для идентификации неагломерированных наноалмазных частиц в медных композиционных материалах</i>
<u>Привезенцев В.В.</u> , Палагушкин А.Н., Скуратов В.А., Куликаускас В.С., Букунов К.А., Бурмистров А.В., Зилова О.С., Штейнман Э.А., Терещенко А.Н.	<i>Исследование пленки диоксида кремния, имплантированной Zn и облученной быстрыми ионами Xe</i>
<u>Приходько А.С.</u> , Боргардт Н.И., Neilmann M., Lopes J-M. J.	<i>Исследование эпитаксиальных слоев многослойного графена и гексагонального нитрида бора методом высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии</i>
Пустовалов Е.В., Модин Е.Б., Федорец А.Н., Ткачев В.В., Грабчиков С.С., Плотников В.С.	<i>Дифракционные методы исследования атомной структуры аморфных металлических сплавов в процессах релаксации и кристаллизации</i>
Рабаданов М.Р., Шапиев И.М., Исмаилов А.М.	<i>Морфология нитевидных кристаллов теллура</i>
Рашковский А.Ю., Дмитриева Т.Г., Радугин А.В., <u>Крупатин И.Н.</u> , Рыжов А.П.	<i>Электронная нанотомография в анализе объемной структуры композиционных материалов на основе ПММА и углеродных волокон с нанотрубками</i>
Садовская Н.В., Хатипов С.А., Кондратенко М.С., Архипов М.А., Бузник В.М.	<i>Применение методов РЭМ, ДСК, РСМА для исследования структуры гомо- и сополимеров тетрафторэтилена, обработанных в сверхкритическом диоксиде углерода и перфтороктане</i>
<u>Седловец Д.М.</u> , Корепанов В.И., Ходос И.И.	<i>Структура полифталоцианинов железа, кобальта, никеля и хрома</i>
Соколов В.Н., Разгулина О.В., Чернов М.С., <u>Комлев Д.И.</u>	<i>Пористые композиционные покрытия на титановых имплантатах</i>
<u>Сорокин Н.И.</u> , Васильев А.Л., Соболев Б.П.	<i>ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУПЕРИОННОГО ПРОВОДНИКА $Sr_{0.65}La_{0.35}F_{2.35}$ СО СТРУКТУРОЙ ФЛЮОРИТА</i>
<u>Сухинина Н.С.</u> , Ходос И.И., Жохов А.А., Масалов В.М., Зверькова И.И., Хасанов С.С., Емельченко Г.А.	<i>Синтез и структура нанокристаллов кубического углерода C_8</i>
Томаев В.В., Полищук В.А., Пшелко Н.С., Васильев Е.А.	<i>Сканирующая электронная микроскопия и оптические свойства в нанопористом оксиде алюминия</i>

Томаев В.В., Полищук В.А., Леонов Н.Б., Васильев Е.А.	<i>Сканирующая электронная микроскопия и плазмонный резонанс в наночастицах цинка</i>
Трунькин И.Н., Васильев А.Л., Галиев Г.Б., Климов Е.А., Клочков А.Н., Пушкарев С.С.	<i>Исследование низкотемпературных структур LT-GaAs и LT-InGaAs методами электронной микроскопии</i>
Трунькин И.Н., Васильев А.Л., Зверев А.А., Казаков И.П., Лихачев И.А., Пашаев Э.М., Пруцков Г.В., Субботин И.А., Цехош В.И.	<i>Исследование гетероструктур GaAs/In(As, Bi) методами электронной микроскопии.</i>
Чапланов А.М., Маркевич М.И., Соловьев Я.А., Сарычев О.Э., Кущев С.Б., Сербин О.В.	<i>Фазовые превращения в системе Ni/Pt/Si при БТО</i>
Чесноков Ю.М., Мяконьких А.В., Рогожин А.Е., Руденко К.В., Васильев А.Л.	<i>Исследование микроструктуры тонких пленок HfO₂, выращенных методом плазменно стимулированного атомно-слоевого осаждения</i>
Чиж К.В., Арапкина Л.В., Дубков В.П., Миронов С.А., Уваров О.В., Ставровский Д.Б., Наливайко О.Ю., Новиков А.Г., Гайдук П.И., Юрьев В.А.	<i>Рост пленок Si на диэлектрическом слое SiO₂/Si₃N₄ и образование силицидов Pt на поли-Si при низких температурах подложки</i>
Шапенков С.В., Вывенко О.Ф., Медведев О.С., Убийвовк Е.В., Seibt M., Saring P.	<i>Структура ядер α-винтовых дислокаций в n-GaN, введенных наноиентированием</i>
Шемченко Е.И., Глазунова В.И.	<i>Особенности наноструктуры плёнок нитрида углерода, легированных оксидом европия в процессе роста</i>
Шмытько И.М., Фролов Д.Д., Аронин А.С., Кедров В.В.	<i>Образование новых структурных состояний в прессованных нанопорошках BaTiO₃</i>
Щербакова О.О., Муравьева Т.И., Загорский Д.Л.	<i>Электронная микроскопия в исследовании новых антифрикционных алюминиевых сплавов</i>

Название секции. 4. Растровая электронная и ионная микроскопии. In-situ исследования в РЭМ.

ФИО докладчика	Название доклада
Uvarov O., Kalinushkin V., Gladilin A., Novikov G.	<i>Application of two-photon confocal microscopy for fluorescent tomography of semiconductor materials</i>
Анашкина Н.Е., Бунин И.Ж., Копорулина Е.В.	<i>Изучение механизма импульсных энергетических воздействий на природные технические алмазы (РЭМ-РСМА, АСМ и ИКФС)</i>
Аникьева А.Э., Петров Ю.В., Вывенко О.Ф.	<i>Вторичная электронная эмиссия из диэлектрических пленок нитрида и диоксида кремния в сканирующем гелиевом ионном микроскопе</i>
Антонова Н.М., Андреев Е.В.	<i>Морфология пористых композитов, полученных из суспензий натрий-карбоксиметилцеллюлозы с наночастицами AlOOH</i>

Антонович А.Н., Петрушин А.А.	<i>Исследование механизмов проводимости наноструктур на основе $PbZr_{0,52}Ti_{0,48}O_3$ методом наведенного тока</i>
Аткин В.С., Смирнов А.В., Горбачев И.А., Бессуднова Н.О., Вениг С.Б.	<i>Исследование самообразующихся кристаллических структур на поверхности дентина методами растровой электронной микроскопии</i>
Бешенков В.Г., Знаменский А.Г., Марченко В.А., Некрасов А.Н.	<i>Диагностика элементного состава пленок ЦТС на платине методом РСМА</i>
Волчков И.С., Ополченцев А.М., Каневский В.М.	<i>РЭМ и АСМ, как методы исследования влияния импульсного магнитного поля на состояние поверхности кристаллов CdTe</i>
Гасенкова И.В., Андрухович И.М., Ткачев В.В.	<i>Методы растровой электронной микроскопии с микроанализом для исследования электрохимического осаждения никеля через слой пористого анодного оксида алюминия</i>
Гелевер В.Д.	<i>Возможности режима прошедшего рентгена в РЭМ для исследования тонких объектов</i>
Гнесин И.Б., Гнесин Б.А., Некрасов А.Н., Желтякова И.С.	<i>О взаимодействии кермета на основе TiC с расплавом Mo_3Si</i>
Горбунов Д.С., Нищев К.Н., Мишкин В.П., Лютова Е.Н., Долганов А.В.	<i>Применение РЭМ и СЗМ для исследования особенностей процессов анодирования алюминия</i>
Гребеньщиков А.С., Волков А.В., Ледер М.О.	<i>Влияние параметров постобработки и шага съемки на результаты обработки карт EBSD</i>
Григоренко В.Б.	<i>Применение растровой электронной микроскопии для изучения поврежденных жаропрочных никелевых сплавов</i>
Князев М.А., Митина А.А., Редькин А.Н., Золотарёва Н.И., Шилкина Н.Н., Гражулене С.С.	<i>Исследование структуры магниточувствительных композитов УНТ/Fe_3O_4 методами сканирующей электронной микроскопии</i>
Крюков Р.Н., Николичев Д.Е., Боряков А.В., Данилов Ю.А., Лесников В.П., Зубков С.Ю.	<i>Физико-химические свойства слоёв разбавленных магнитных полупроводников, выращенных методом импульсного лазерного осаждения</i>
Малышкина О.В., Иванова А.И., Малышкин Ю.А., Фоломеева А.С.	<i>Выявление неоднородности структуры монокристаллов твердых растворов CSBN методом РЭМ</i>
Маслов В.Г., Митюхляев В.Б., Филиппов М.Н.	<i>Трёхмерная реконструкция элементов микро- и нанорельефа в РЭМ</i>
Новиков Ю.А.	<i>Влияние наклона электронного зонда на калибровку РЭМ</i>
Новиков Ю.А.	<i>Особенности формирования изображений трапецевидных структур с большими углами наклона боковых стенок в РЭМ в режиме сбора вторичных медленных электронов</i>
Ополченцев А.М., Волчков И.С., Колымагин А.Б., Задорожная Л.А., Каневский В.М.	<i>Влияние обработки слабыми магнитными полями на морфологию наноструктур оксида цинка</i>
Орлов В.И., Солтанович О.А., Ярыкин Н.А., Якимов Е.Б.	<i>Влияние никеля на рекомбинационные свойства протяженных дефектов в кремнии</i>

Попов В.А.	<i>Применение сканирующей электронной микроскопии для изучения структуры металлматричных композитов с неагломерированными наноалмазными упрочняющими частицами</i>
<u>Попов В.А.</u> , Просвиряков А.С., Ковальчук М.Н.	<i>Исследование структуры гранул композиционных материалов, полученных с применением механического легирования</i>
<u>Попов В.А.</u> , Котов А.Д.	<i>Исследование структуры металлматричных композитов с упрочняющими наночастицами карбида титана, полученными "in-situ" синтезом в алюминиевой матрице при механическом легировании</i>
<u>Привезенцев В.В.</u> , Палагушкин А.Н., Скуратов В.А., Куликаускас В.С., Букунин К.А., Бурмистров А.В., Зилова О.С., Штейнман Э.А., Терещенко А.Н.	<i>Исследование пленки диоксида кремния, имплантированной Zn и облученной быстрыми ионами Хе</i>
<u>Пронин В.П.</u> , Долгинцев Д.М., Каптелов Е.Ю., Сенкевич С.В., Пронин И.П.	<i>Структура, состав и диэлектрические свойства тонких пленок PZT в области морфотропной фазовой границы</i>
<u>Рау Э.И.</u> , Смоляр В.А., Караулов В.Ю., Зайцев С.В., Мхитарян В.М.	<i>Определение средней энергии и коэффициента отраженных электронов в зависимости от угла их выхода</i>
Росляков И.В., Калинин И.А., Напольский К.С.	<i>Рекристаллизация тонких пленок платины для создания устройств микроэлектроники нового поколения</i>
<u>Румянцев А.В.</u> , Боргардт Н.И.	<i>Моделирование формирования микро- и наноструктур фокусированным ионным пучком методом функций уровня</i>
Рыбалко В.В., Кулинич В.И.	<i>РЭМ-исследование слоев нитрида титана, наносимых на внутренние поверхности каналов</i>
<u>Сазонов В.А.</u> , Боргардт Н.И., Кукин В.Н., Казаков И.П.	<i>Анализ мозаичной структуры низкотемпературного арсенида галлия методами просвечивающей растровой электронной микроскопии</i>
Свинцов А.А., Якимов Е.Б., Дорохин М.В., Дёмина П.Б., Шенгуров В.Г., Звонков Б.Н.	<i>Моделирование параметров бетавольтаического элемента на основе тритида титана</i>
Смирнов А.В., Аткин В.С., Горбачёв И.А., Вениг С.Б.	<i>Сканирующая электронная микроскопия в исследовании металл - полимерных композиционных материалов</i>
Соколов Л.В., Агафонова Н.А.	<i>Исследование упругих напряжений на границах раздела КНИ гетероструктуры микроэлектромеханического преобразователя давления с изолированной тензорамкой</i>
<u>Станчик А.В.</u> , Константинов С.В., Башкиров С.А., Гременок В.Ф., Петлицкий А.В., Петлицкая Т.В., Хорошко В.В.	<i>Анализ химического состава пленок $Cu_2ZnSnSe_4$ на гибких подложках методом резерфордского обратного рассеяния</i>
<u>Суродин С.И.</u> , Шоболов Е.Л.,	<i>Подготовка поперечных сколов для РЭМ методом</i>

Николичев Д.Е.	<i>трехлучевой ионной резки</i>
Чуева Т.Р., Молоканов В.В., Умнова Н.В., Умнов П.П.	<i>Исследование конструкционных аморфных проводов Со-сплава методом электронной микроскопии</i>
Юдинцева Т.И., Рашковский А.Ю., Дмитриева Т.Г., Радугин А.В.	<i>Исследование механизмов деформации и разрушения полимерного композита с углеродными нанотрубками in-situ при динамическом нагружении в РЭМ</i>
Якимов Е.Е., Якимов Е.Б.	<i>КЛ исследование гибридных органо-неорганических перовскитов, не содержащих Pb</i>
Якимов Е.Е., Яковлев А.Ю., Якимов Е.Б.	<i>Измерение диффузионной длины в Ga₂O₃</i>

Название секции. 5. Методы электронной микроскопии и микроанализа в исследовании предметов культурного наследия.

ФИО докладчика	Название доклада
Антонова Е.И., Кадикова И.Ф., <u>Макарова А.С.</u>	<i>Опыт использования электронной микроскопии для уточнения технологии ранее выполненных реставрационных работ на белокаменном портале бахчисарайского ханского дворца</i>
Курганов Н.С., <u>Петров Ю.В.</u> , Поволоцкая А.В., Панькин Д.В., Курочкин А.В.	<i>Исследование влияния процесса лазерной очистки на состав и микротопографию поверхности старинных монет</i>
Лобзова Р.В., Магазина Л.О., Макарова А.С., Мاستыкова А.В.	<i>Исследование материала глазурованной керамики с помощью сканирующего электронного микроскопа.</i>
<u>Шибанова И.Н.</u> , Писарева С.А., Чайкина Ю.В.	<i>Электронная микроскопия как один из методов в экспертизе произведений живописи</i>
<u>Юрьева Т.В.</u> , Афанасьев И.Б., Кадикова И.Ф., Морозова Е.А., Григорьева И.А., Лукашова М.В., Ключникова Д.О., Малыхин С.А., Уваров О.В., Юрьев В.А.	<i>Коррозия и разрушение стекла цветного бисера XIX века: исследование методами электронной микроскопии</i>

Название секции. 6. Сканирующая зондовая микроскопия

ФИО докладчика	Название доклада
<u>Валиев Х.Х.</u> , Минаев А.Я., Степанов Г.В., Карнет Ю.Н., Юмашев О.Б.	<i>Сканирующая зондовая микроскопия магнитореологических эластомеров</i>
<u>Валуева С.В.</u> , Вылегжанина М.Э.	<i>Влияние природы полимерного стабилизатора на морфологические, молекулярно-конформационные и спектральные параметры селенсодержащих наноструктур</i>
Воробьев В.В., Рогов А.М., Осин Ю.Н., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л.	<i>Характеризация распыления поверхности кремния при имплантации ионами серебра методом сканирующей зондовой микроскопии</i>
<u>Гайнутдинов Р.В.</u> , Волк Т.Р.,	<i>Особенности процессов переключения в сегнетоэлектрических кристаллах в поле зонда</i>

Боднарчук Я.В., Симагина Л.В.	<i>атомно-силового микроскопа</i>
Гайнутдинов Р.В., <u>Толстихина А.Л.</u> , Селезнева Е.В., Макарова И.П.	<i>АСМ-исследование новых сегнетоэлектрических кристаллов кислого сульфата аммония-калия</i>
Глухов В.С.	<i>Использование преобразования Фурье при анализе изображений доменной структуры кристаллов семейства триглицинсульфата</i>
<u>Губанова Г.Н.</u> , Вылегжанина М.Э., Волков А.Я., Кузнецов Д.А., Кононова С.В.	<i>АСМ исследование морфологии непористых пленок и микропористых мембран на основе сополиамидоимидов</i>
Еременко В.Г.	<i>Особенности возникновения, структура и электрические свойства гексагонального Si-IV кремния</i>
Ермолаева О.Л., Скороходов Е.В., Сапожников М.В., Володин А.П., Миронов В.Л.	<i>Влияние ориентации магнитного момента зонда магнитно-резонансного силового микроскопа на спектры спин-волновых резонансов</i>
Жуйков В.А., Бонарцев А.П., Бонарцева Г.А.	<i>Изучение гидролитической деградации поли-3-оксибутирата методом атомно-силовой микроскопии.</i>
Каминская Т.П., Тихонов А.И., Шипко М.Н., <u>Степович М.А.</u>	<i>Атомная силовая микроскопия поверхности фольги электротехнической стали</i>
Климин В.С., Резван А.А.	<i>Исследование применения локального анодного окисления с последующим плазмохимическим травлением для формирования устройств наноэлектроники</i>
Коньшин А.А., Ильина М.В., Ильин О.И.	<i>Исследование влияния диаметра пучка деформированных углеродных нанотрубок на величину поверхностного потенциала</i>
<u>Криничная Е.П.</u> , Иванова О.П., Завьялов С.А., Кривандин А.В., Журавлева Т.С.	<i>Исследование методом атомно-силовой микроскопии поверхностной структуры тонких пленок полимерных нанокомпозитов ППК+PbSe</i>
<u>Криничная Е.П.</u> , Иванова О.П., Завьялов С.А., Журавлева Т.С.	<i>Топография поверхности полимерных нанокомпозитов на основе поли-п-ксилилена и сульфидов металлов</i>
Кутровская С.В., <u>Шагурина А.Ю.</u> , Лелекова А.Ф., Новикова О.А., Кель А.В.	<i>Метод индуцированного осаждения планарных наноструктур на базе зондовой нанолаборатории NTEGRA Aura</i>
<u>Местер А.Ю.</u> , Орехова К.Н., Серов Ю.М., Дементьев П.А., Попова Т.Б., Заморянская М.В.	<i>Формирование углеводородной плёнки на поверхности материалов при облучении электронным пучком</i>
<u>Муслимов А.Э.</u> , Буташин А.В., Старчиков С.С., Каневский В.М.	<i>Зондовая микроскопия и спектроскопические исследования вакуумной термодеструкции поверхности кристаллов SiC при синтезе графена в потоке железа</i>
<u>Муслимов А.Э.</u> , Буташин А.В., Каневский В.М.	<i>Применение зондовой микроскопии для изучения электрофизических свойств и структурной перестройки поверхности кристаллов V₂O₅ в процессе вакуумного отжига</i>
<u>Муслимов А.Э.</u> , Буташин А.В.,	<i>Магнитно-силовая микроскопия пленок ферритов</i>

Каневский В.М.	<i>висмута, никеля, кобальта</i>
Муслимов А.Э., Буташин А.В., Каневский В.М.	<i>Зондовая и электронная микроскопия селективно-фотопроводящих пленок β-Ga₂O₃- In₂O₃, полученных твердофазной эпитаксией</i>
Николаев А.Н., Баньковская И.Б., Пугачев К.Э, Коловертнов Д.В.	<i>Исследование структуры поверхности покрытий на основе композиции Si-B₄C-ZrB₂</i>
Новак А.В., Новак В.Р.	<i>Эволюция морфологии поверхности при анизотропном травлении кремния</i>
Покотило Ю.М., Петух А.Н., Смирнова О.Ю., Королик О.В., Мазаник А.В., Маркевич В.П., Гиро А.В., Гременок В.Ф., Стельмах Г.Ф.	<i>Формирование водородных пузырей в гидрогенизированном кремнии при термообработке</i>
Рогов А.М., Воробьев В.В., Осин Ю.Н., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л.	<i>Сканирующая зондовая микроскопия и спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния германиевых слоев, имплантированных ионами серебра</i>
Сазанова Т.С., Отвагина К.В., Воротынцев И.В.	<i>Особенности структурообразования поверхности полимерных мембран на основе хитозана по данным атомно-силовой микроскопии</i>
Степанцов Е.А.	<i>Выращивание и исследование поверхности бикристаллических пленок YBa₂Cu₃O₇ с изгибом SiO-плоскостей до 90°</i>
Тикото С.Э., Тиванов М.С., Гременок В.Ф., Хорошко В.В.	<i>Влияние отжига на микроструктуру тонких пленок In₂S₃, полученных методом термического испарения</i>
Толстихина А.Л., Гайнутдинов Р.В., Белугина Н.В., Рошин Б.С., Золотов Д.А., Асадчиков В.Е., Шут В.Н., Мозжаров С.Е., Кашевич И.Ф.	<i>Исследование ростовой периодической примесной структуры кристаллов TGS методами сканирующей зондовой микроскопии и рентгеновских методов анализа</i>

Название секции. 8. Электронная и ионная литография. Микроскопия в современных технологиях.

ФИО докладчика	Название доклада
Григорьев Е.А., Петров Ю.В., Барабан А.П., Шаров Т.В.	<i>Локальное управление скоростью химического травления диоксида кремния при помощи гелиевого ионного микроскопа</i>
Зайцев С.И., Князев М.А., Свинцов А.А.	<i>Расчет распределения поглощенной энергии электронов методом Монте-Карло и представление функции близости тремя параметрами α, β, η</i>
Ильин А.И., Иванов А.А., Трофимов О.В., Фирсов А.А. Никулов А.В., Тулин В.А., Зотов А.В.	<i>Изготовление и электрические характеристики ассиметричных колец из ВТСП YBCO пленок, полученных методом импульсного лазерного напыления</i>
Князев М.А., Свинцов А.А., Фахртдинов Р.Р., Рошупкин Д.В.	<i>Развитие методов электронно-лучевой литографии для создания периодических рентгеновских дифракционных элементов</i>
Коханчик Л.С., Шандаров С.М., Волк Т.Р.	<i>Формирование периодических доменных структур при электронном облучении волноводов Ti:LiNbO₃</i>

Коханчик Л.С., Волк Т.Р.	<i>Особенности записи доменных структур электронным лучом в кристаллах $LiNbO_3$ с повышенной проводимостью</i>
Лапин Д.Г., Овчинников И.С.	<i>Зависимость удельного сопротивления нанопроводов из вольфрама от параметров локального ионно-лучевого осаждения</i>
Михайлов М.С., Марголин Б.З., Петров С.Н., Печенкин В.А., Сорокин А.А.	<i>Оценка радиационной повреждаемости материалов для ВКУ после имитационного облучения ионами никеля</i>
<u>Панченко И.В.</u> , Шандыба Н.А., Коломийцев А.С.	<i>Формирование элементов автоэмиссионной наноэлектроники методом фокусированных ионных пучков</i>

Название секции. 9. Электронная микроскопия в химии, геологии и метеоритоведении.

ФИО докладчика	Название доклада
Кузьмин В.А., Скибицкая Н.А., Большаков М.Н.	<i>Структура порового пространства пород нижнемеловых отложений (K_1) Восточно – Бирюзакской площади</i>
Кузьмин В.А., Скибицкая Н.А.	<i>Особенности микростроения глубокозалегающих карбонатно- кремнистых пород</i>
Лемазина Ю.А., Юсупова А.Р., Кузина Д.М., Воробьев В.В., Марков Г.П.	<i>Микрометеориты из оз. Тургояк</i>
Округин В.М., Козлов В.В., Кудаева Ш.С., Малик Н.А., Плутахина Е.Ю., Каримова О.В., Карташов П.М., Москалева С.В., Чубаров М.В., Лукашева М.В., Брюггер Д., Этшман Б.	<i>Наталиямаликит и новограбленовит – новые минералы в продуктах современной вулканической деятельности Камчатки</i>
Сергиенко Е.С., <u>Янсон С.Ю.</u> , Флоренский П.В., Харитонский П.В., Костеров А.А., Гордюшин Д.С.	<i>Микровключения в иргизитах</i>
Скибицкая Н.А., Кузьмин В.А.	<i>Создание керновых моделей с учетом микроструктурных особенностей порового пространства пород</i>
Скибицкая Н.А., Кузьмин В.А., Судьин В.В.	<i>Исследование органического вещества в породах-коллекторах нефти и газа в РЭМ.</i>
<u>Татаринов В.В.</u> , Финкельштейн А.Л., Павлова Л.А.	<i>Способ определения пробности тонкодисперсного золота в сульфидных минералах методом РСМА</i>
Юсупова А.Р., Косарева Л.Р., Воробьев В.В.	<i>Электронная сканирующая микроскопия при изучении магнитной фракции донных отложений на примере озер Южного Урала</i>

Название секции. 10. Другие применения электронной микроскопии и комплементарных методов.

ФИО докладчика	Название доклада
Аксенов О.И., Орлова Н.Н., Аронин А.С.	<i>Изучение корреляции магнитной и атомной структуры и гистерезисных свойств микропроводов</i>
<u>Алехин Ю.В.</u> , Макарова М.А., Козаченко Е.А., Шипилова Е.С., Ивлева Е.А.	<i>Исследование мембранных материалов с помощью электронной микроскопии</i>
Анашкина Н.Е., <u>Бунин И.Ж.</u> , Копорулина Е.В.	<i>Изучение механизма импульсных энергетических воздействий на природные технические алмазы (РЭМ-РСМА, АСМ и ИКФС)</i>
<u>Артемов В.В.</u> , Давыгора А.П., Сыров Ю.В.	<i>Морфология и состав сульфидов индия и сурьмы, образующихся при взаимодействии серы с антимонидом индия</i>
Васильева В.И., Голева Е.А., Смагин М.А., Абрамова Е.О.	<i>РЭМ исследование структурных особенностей профилированной сульфокатионообменной мембраны в растворах алкилароматической аминокислоты</i>
<u>Горбунов Д.С.</u> , Нищев К. Н., Мишкин В.П., Лютова Е.Н., Долганов А.В.	<i>Применение РЭМ и СЗМ для исследования особенностей процессов анодирования алюминия</i>
<u>Гришанцева Е.С.</u> , Шевченко В.П., Боев А.Г., Федорова Л.П.	<i>Опыт применения электронной микроскопии при эколого-геохимических исследованиях взвеси Ивановского водохранилища</i>
Гуляев А.И., Зайцев Д.В.	<i>Микроструктурный и фрактографический анализ полимерных материалов авиационного назначения</i>
<u>Ермаков М.А.</u> , Гончаров А.В., Ким Е.Д.	<i>Исследование интерметаллидных соединений Al-Ni-РЗМ в комплексных лигатурах для алюминиевых сплавов систем Al-Si и Al-Cu</i>
Исхакова Л.Д., Милович Ф.О., Лукашова М.В., Сомов П.А., Вельмискин В.В., Пластинин Е.А.	<i>Исследование микроструктуры и состава допированных висмутом пористых стёкол для изготовления волоконных световодов</i>
Кулинич В.И., Бубликов Е.И., Коломиец В.В., Лялько Е.С., Чертова И.А.	<i>Применение методов ПЭМ при формировании сегментированных магнитных наноструктур</i>
<u>Ловыгин М.В.</u> , Казанский П.Р., Рашковский А.Ю., Марясев И.Г., Мамлеев Р.Ф.	<i>Комплексная характеристика структуры керметов на основе карбида титана</i>
<u>Михуткин А.А.</u> , Камышинский Р.А., Орехов А.С., Тенчурин Т.Х., Григорьев Т.Е., Чвалун С.Н., Васильев А.Л.	<i>Трёхмерная реконструкция и анализ биосовместимых матриц по данным конфокальной лазерной сканирующей и растровой электронной микроскопии</i>
<u>Морозова Л.В.</u> , Григоренко В.Б.	<i>Исследование причин разрушения крыльчатки и колеса вентилятора из сплава АК4-1</i>
Посельская Ю.В., Викторов В.В., Белая Е.А.	<i>Исследование морфологии оксигидратов алюминия, полученных гидролизом в присутствии ПАВ</i>
Соколов Л.В., Агафонова Н.А.	<i>Исследование упругих напряжений на границах раздела КНИ гетероструктуры микроэлектромеханического преобразователя давления с изолированной тензорамкой</i>

Соколов В.Н., Чернов М.С., Кузнецов Р.А., Разгулина О.В., Денисова Л.Г., Юрковец Д.И.	<i>Применение электронной микроскопии и компьютерной томографии при деформационных испытаниях глинистых грунтов</i>
<u>Станчик А.В.</u> , Константинов С.В., Башкиров С.А., Гременок В.Ф., Петлицкий А.В., Петлицкая Т.В., Хорошко В.В.	<i>Анализ химического состава пленок $Cu_2ZnSnSe_4$ на гибких подложках методом резерфордского обратного рассеяния</i>
Степанцов Е.А.	<i>Выращивание и исследование поверхности бикристаллических пленок $YBa_2Cu_3O_7$ с изгибом SiO-плоскостей до 90°</i>
<u>Федорец А.</u> , Привар Ю., Малахова И., Модин Е., Братская С.	<i>Полиэтилениминовые криогели для сорбции ионов металлов</i>
Чернов М.С., Соколов В.Н., Крупская В.В.	<i>Микроморфологические исследования осадка наночастиц природных глинистых грунтов</i>
Шефтель Е.Н., <u>Теджетов В.А.</u> , Жигалина О.М., Харин Е.В., Кирюханцев-Корнеев Ф.В., Усманова Г.Ш., Хмеленин Д.Н.	<i>Исследование нанокристаллической структуры магнитномягких пленок $Fe-Zr-N$ и $Fe-Ti-B$ методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции</i>
Шипко М.Н., <u>Степович М.А.</u> , Сибирев А.Л.	<i>О возможности использования киловольтных электронов для изучения структуры жидких объектов</i>